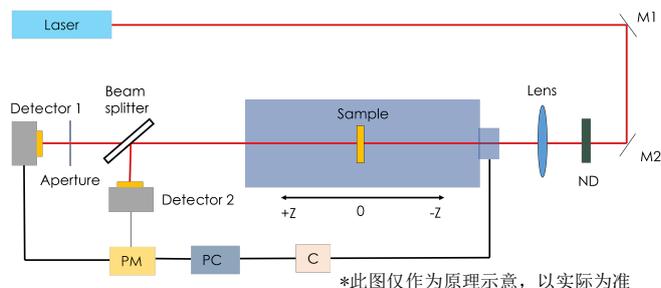


测量三阶光学非线性的Z扫描系统

Waynelabs³的Z扫描测量系统，可用于研究光子材料的三阶非线性吸收特性，三阶非线性折射，三阶非线性极化率及单光子/双光子品质因子。此系统将工控机、电机控制器、Z扫描光路高度集成，设备占地小且方便移动。将样品放置好后，按操作说明可进行一键全自动测量。

系统原理示意图



应用场景

表征非线性光学材料的三阶非线性光学特性，包括三阶非线性吸收系数和三阶非线性折射，三阶非线性极化率及单光子/双光子品质因子。

- ◆ 砷酸锂、ZnO等薄膜材料；
- ◆ 贵金属纳米结构溶液或者薄膜材料；
- ◆ 二维材料（TMDs、钙钛矿等）薄膜。

典型数据图

